

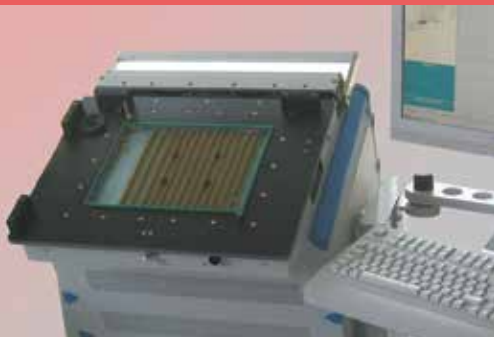
CT300, CT350

MDA, ICT, FKT

ELEKTRISCHER TEST

MDA, ICT, FKT, INSPEKTION

- SKALIERBARE MODULTECHNIK (MDA, ICT, FKT, BSCAN)
- VIELFÄLTIGER SYSTEMAUFBAU (19", TISCH, RACK, INLINE)
- UMFANGREICHE FUNKTIONSTEST-LÖSUNGEN
- UMFANGREICHE CAD-IMPORTE, PAPIERLOSE REPARATURSTATION, STATISTIK FUNKTIONEN UND DATENBANKANBINDUNG INKLUSIVE
- IN DER TESTER-SOFTWARE INTEGRIERTER aOI UND LED-TEST
- MADE IN GERMANY



ATE  CARE
AUTOMATIC TEST EQUIPMENT

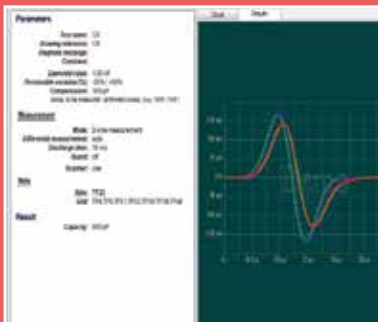


ANALOG-TEST

MDA: MANUFACTURING DEFECT ANALYZER

Das System ist sehr einfach zu handhaben.

Die CT300-Serie ist in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich. In allen Varianten kommt dabei die komplett identische Plattform zum Einsatz.



Scope-Funktion



Analog-Modul



PIN-Scan®-Modul

INTEGRIERTE VERFAHREN

- Oszilloskope
- DVM (Digital-Volt-Meter)
- AWG (Arbitrary Waveform Generator)

POLARITÄTSTEST BEI KONDENSATOREN

- Leckstrom-Messung
- Pin Scan® Erkennung

aOI-TEST

- Anzeigenerkennung
- Polung
- Vermessungen

STROMVERSORGUNG

- Umfangreich On-Board
- interne und externe Erweiterungen
- automatische Entladeroutinen

RCL-PRÜFUNG

- ATG automatischer Testgenerator
- 4-Draht Messung
- Guarding

PRÜFUNG VON TRANSISTOREN/DIODEN

- Dioden
- Zener-Dioden
- Transistoren: PNP, NPN
- FETs/Thyristoren (SCR)/TRIACs
- Opto-Koppler

LED-INSPEKTION

- Glasfaser Kontakt
- Verstärker im POGO Kontaktblock
- sehr schnelle und präzise Inspektion

PIN SCAN® TECHNOLOGIE

- Erkennt Unterbrechungen bei SMT Bauteilen, z.B. an ICs oder Steckern



CT300 Meteor



CT300 Satellite

DIGITAL-TEST

ICT: IN-CIRCUIT-TEST

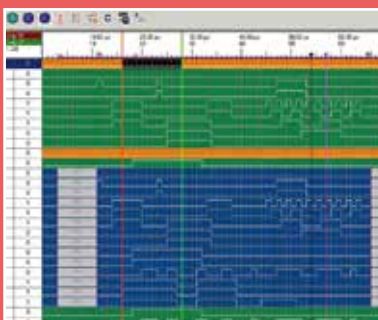
Durch die enge Zusammenarbeit und Beratung zwischen Entwicklern und Anwendern wird das Testsystem entsprechend den Bedürfnissen der Kunden konfiguriert und angepasst.



CAD-Daten Aufbereitung



Digital-Modul



Digitalsignal-Editor

DIGITALTEST

- Schneller Digitaltest bis 300 MS/s
- Hochvolt-Digitalmodul bis 35 V

LEISTUNGSFÄHIGER BOUNDARY SCAN TEST

- Der Boundary Scan Test nach IEEE1149.6
- Integriert in der Tester-Software
- optionale Integration anderer Hersteller

EINFACH ZU BEDIENENDE ONBOARD PROGRAMMSOFTWARE

Modularisierte Speicher-Algorithmen ermöglichen eine einfache On-Board Programmierung:

- OBP-Karten für die parallele Programmierung unterschiedlicher Inhalte
- Flash Programmierung
- Serielle Programmierung
- EE-PROM Programmierung

EINFACHE BEDIENUNG

Die Bedienung ist flexibel und leicht verständlich:

- Grafischer Programm-Editor
- eigene Skripte möglich
- Kurvenformen editierbar

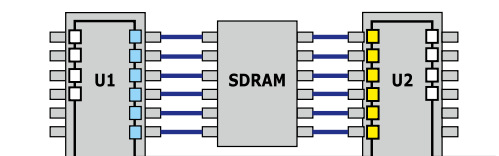
OPTIONALE STROMVERSORGUNGEN

- Festspannungsquellen
- programmierbare AC und DC Quellen

WIRTSCHAFTLICHE TESTSTRATEGIE

- Pin-Architektur ist nicht gemultipliziert.
- automatisierte Pin-Verteilung
- leichte Anpassung bei Änderungen
- Softwaregeführtes Debug-Verfahren
- Integrierte Selbsttest Diagnose

Auch nicht-Boundary-Scan fähige Bauelemente können verkettet werden



FUNKTIONS-TEST

**FKT: LEICHTE INTEGRATION
EXTERNER MODULE IN
BESTEHENDE SOFTWARE-
STRUKTUREN**

Das Grundsystem besteht aus einem variablen Gehäuseaufbau. Je nach Kundenwunsch und -bedarf lassen sich einfache Tischaufbauten, Integrationen in 19" Racks, pneumatische Press-down-Units, vakuumbasierende Tischaufbauten bzw. In-Line Kombinationen erstellen.

Die Software ist intuitiv grafisch bedienbar und bedarf keiner Ausbildung für Hochsprachen. Als Komplettpaket gibt es die Software zur Bearbeitung von CAD-Daten, den automatischen Testprogramm-Generator (ATG) und die Bediener- und Reparatur-Software.

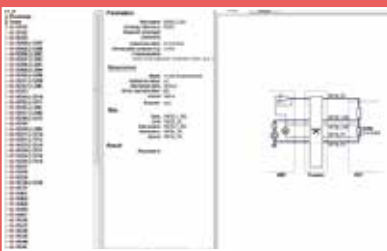
Die dazu gehörige Adaption kann daher ebenso vielfältig gestaltet sein (z.B. Handhebeladapter, Press-Down Konzepte, Nadelbettadapter mit Vakuumanschluss, Wechselsatzadapter, etc.). Dies bestimmt in aller Regel der maximale Pinausbau oder der spezielle Kundenwunsch.



Inline Testhandler mit
CT300



Reparaturstation



Programmierung



Erweiterung zum FKT

IN-CIRCUIT- UND FUNKTIONSTEST IN EINEM SYSTEM

Integration von vielfältigen, selbst erstellten oder am Markt verfügbaren Modulen, z.B.:

- RS 232
- GPIB
- PXI
- USB
- Anbindung von anderen Bus-Strukturen (z.B. CAN-Bus, MOST-Bus, etc.)
- 2-Stufen-Adaptierung: Vakuum, pneumatisch, mechanisch und elektrisch
- Integration vorhandener Adaptionenlösungen
- In-Line Lösungen verfügbar
- Anbindung an DB und Traceability

OPTIONEN

- Testadapter
- Konvertierung bestehender Adaptionenlösungen ist möglich
- Programmierdienstleistung

CT350 Comet



LEICHTER AUS- UND UMBAU MIT BEREITS BESTEHENDEN MODULEN

AUSBAU

MDA → ICT → FKT

Eine MDA Grundversion enthält alle notwendigen Hard- und Software-Module. Die Aufrüstung zu einem vollwertigen ICT-Testsystem erfolgt über eine Hardware-Erweiterung. Für den Vollausbau zum Kombitester kann das MDA/ICT der Master sein oder der FKT ist der Master des MDA/ICT.

UMBAU

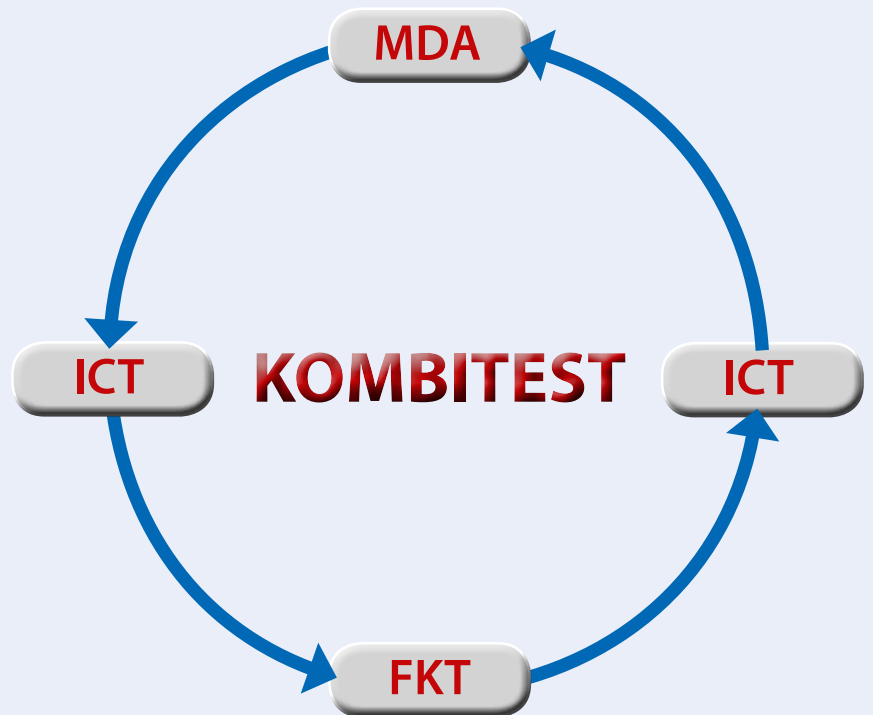
FKT → ICT → MDA

Das System ermöglicht frei skalierbare Hardware-Zusammenstellungen - die Software ist schon dabei.

Es ist mit aOI Funktionen erweiterbar (Displays, LED, Vermessung etc.).

ERWEITERUNGEN

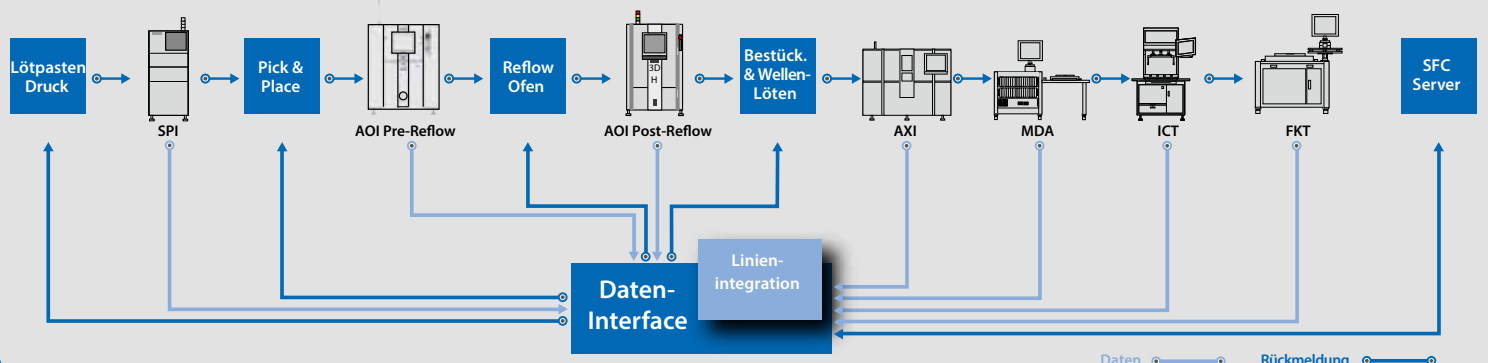
Selbstverständlich ist das System auch mit Boundary-Scan Lösungen, vektorlosen Testverfahren, LED-Testverfahren, externen Geräteerweiterungen sowie Schnittstellen zu MES/ Traceability Systemen vorbereitet und jederzeit erweiterbar.



MDA: Manufacturing Defect Analyzer
ICT: In-Circuit Test
FKT: Funktions-Test

LINIENINTEGRATION

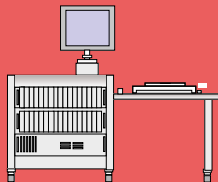
ANBINDUNG AN HANDLING-SYSTEME, AOI-REPARATURPLÄTZE, INTEGRATION IN MES- UND TRACEABILITY-WERKZEUGE



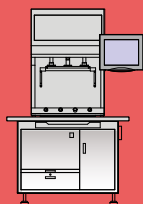
SKALIERBARE TEILLÖSUNGEN



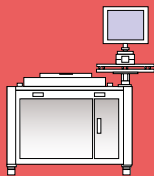
DESKTOP



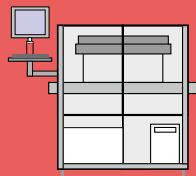
TISCH & RACK



PRESS DOWN



VAKUUM



IN-LINE

ALLGEMEIN

Bis zu 5.472 analoge Testpunkte, in Schritten von 144/72 Pins pro Modul
Betriebssystem: Microsoft® Windows 7®, Windows 10®
Stromversorgung: 230 V, automatische Umschaltung, 50/60 Hz
Test-Adapter: manuell, elektrisch oder Vakuum (optional)

MESSEINRICHTUNGEN, ANALOG

Test-Schaltmatrix: 4/8-Draht-Matrix
Frequenzen: 0,3 Hz, bis 20 MHz
Spannungsquelle: -36 V bis ± 40 V, Auflösung: 10 mV
Stromquelle: 0 bis 500 mA, Auflösung: 0,1 mA
DC-Hochspannungsquelle: 0 bis 52 V (integriert)
Waveform-Generator: ± 9 V, 30 MS/s @ 16 bit Auflösung oder $\pm 2,5$ V, 125 MS/s

Messung von Bauteilen

Widerstände: 100 mOhm bis 20 MOhm
Kapazitäten: 5 pF bis 1 F
Induktivitäten: 1 μ H bis 10 H

Analog-Messungen

AC-Voltmeter: 0 bis 60 V
DC-Voltmeter: 0 bis 60 V
DC Amperemeter: 0 bis 500 mA

DUT-Spannungen

Fest: 5 V, 12 V, -12 V
Variabel: 0 bis 51 V
DC Amperemeter: 0 bis 500 mA

MESSEINRICHTUNGEN, OPTIONAL

Analog-Test

PIN Scan® Technologie: Vektorlose Erkennung offener Lötverbindungen
Kondensatorpolarisierung

Digital-/Funktionstest

1:1 Pin-Architektur, nicht gemultiplext
Umfangreiche Funktions-Test Optionen (eigene Produkte oder/und externe Anbindungen)

MASSE/GEWICHT/AUFBAU/FORM

Auf Anfrage



Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.atecare.de.
Sie erhalten dort ausführliche Informationen zu unseren Produkten, vom einfachen MDA über In-Circuit- und Boundary-Scan-Test bis hin zu 3D SPI-, AOI- und AXI-Technologien.
Wir sind der Partner an Ihrer Seite, wenn es um Test- und Inspektionslösungen geht.
ATEcare vertritt führende Hersteller aus aller Welt

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Markennamen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Abbildungen ähnlich.

ATE CARE
AUTOMATIC TEST EQUIPMENT

ATEcare Service GmbH & Co. KG
Vertrieb und Service
Neufeldstraße 14
85232 Günding
Deutschland

Tel. +49 8131 318 575-120
Fax +49 8131 318 575-411
e-Mail info@atecare.com

ATEcare Alexander Hörtnert
Vertrieb, Service, Support CH
Friedhofweg 5
9434 Au
Schweiz

Tel. +41 71 740 10 90
Fax +41 71 740 10 91
e-Mail info@ATEcare.net

Dr. Eschke
Elektronik

www.dr-eschke.de

www.atecare.de